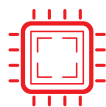
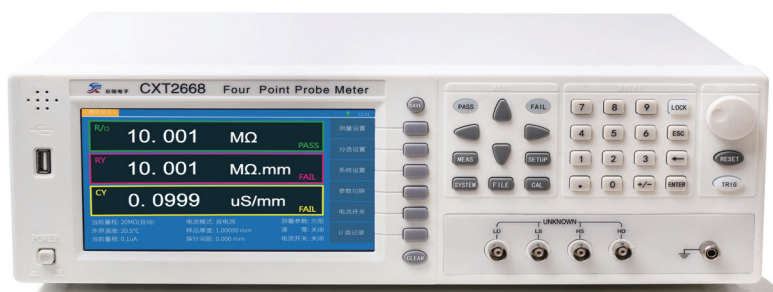


CXT2668

宽量程四探针方阻测试仪



技术参数

TECHNICAL
PARAMETER

产品型号	CXT2668
显示	
显示器	24位色,分辨率800*480的真彩IPS LCD液晶屏
读数位数	4½位
电阻/方阻/电阻率测量	
测量范围	1uΩ~100MΩ,电阻率范围取决于方阻及被测件尺寸
电阻精度	电阻: 0.05% 方阻/电阻率: 3%(详见使用说明书)
最大测试电流	500mA
测量功能	
可测样品尺寸	无尺寸要求
测量模式	双电测/单电测可切换
测量参数	电阻、电阻率、电导率
测量参数保存	10组
温度测量	
测量参数	基本精度0.1℃
显示范围	-10℃ - 99.9℃
湿度测量	
测量参数	基本精度±1.5%
显示范围	0 - 100%
比较器	
信号输出	HI / PASS / LO / FAIL
讯响	合格 / 不合格 / 关闭
极限设置方式	3档;绝对值上 / 下限;百分比上 / 下限+标称值
其他参数	
接口	USB HOST / USB DEVICE/RS232 / HANDLER / RS485
尺寸与重量	长x宽x高: 400 mm x 350mm x 130 mm ;净重约8KG



性能特点

PERFORMANCE
CHARACTERISTICS

- 最高电阻精度: 0.05 %; 电阻最小分辨: 1uΩ
- 最高方阻精度: 3 %; 方阻最小分辨: 1uΩ
- 温度补偿功能 (TC); 温度基本精度: 0.1 °C
- 零底数设计, 微弱电阻测试无需清零
- 被测件厚度可预设, 电阻率测试无需查表
- 双电测模式, 修正探针游移与样品边际效应
- 电阻/方阻、电阻率、电导率、温湿度同步测试
- HANDLER / USB/RS232/ RS485接口远程控制
- U盘记录测试数据, 并可远程升级仪器软件
- 符合GBT 1551-2009及GBT 1552-1995
- 适用于测量半导体、导电薄膜、金属/纳米涂层、太阳能材料、陶瓷、半绝缘材料及各种新材料等



随机配件

INSTRUMENT
ACCESSORIES

标准配件

CXT28011四端开尔文测试夹
CXT30010三相电源线
CXT30WX35温湿度传感器
USB/232通讯电缆
CXT26301方阻测试台
CXT26500/26501/26502/26505
四探针测试探头(四选一)

可选配件

数据采集软件